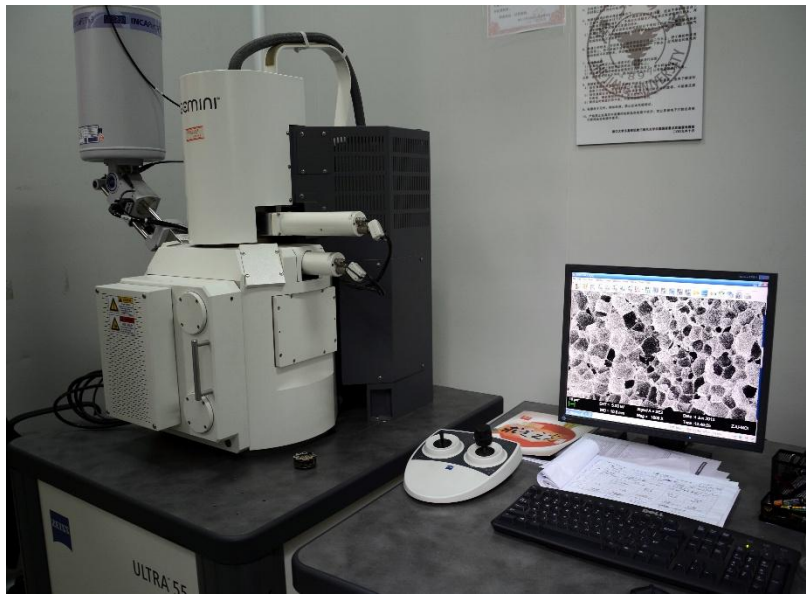


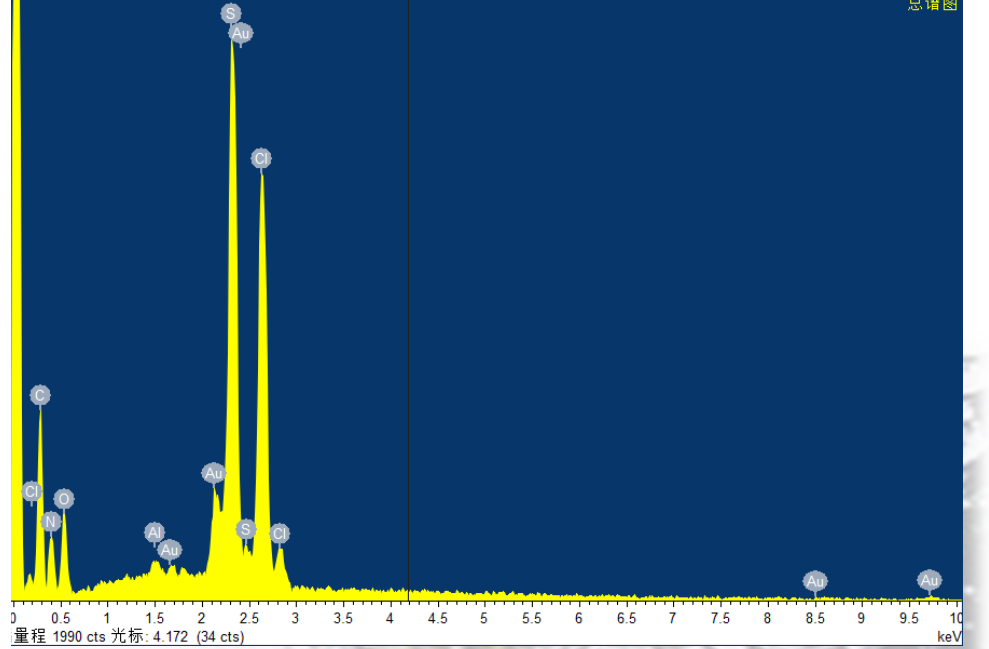
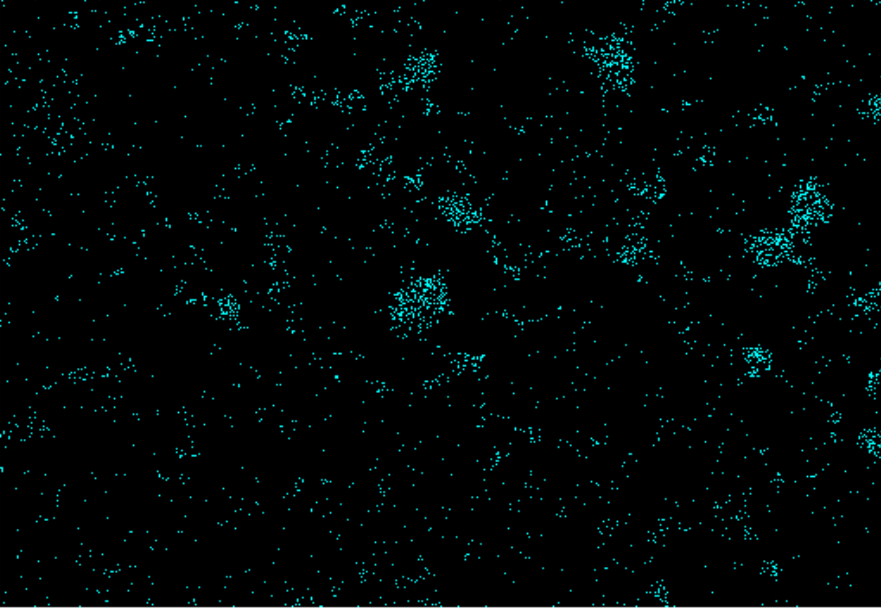
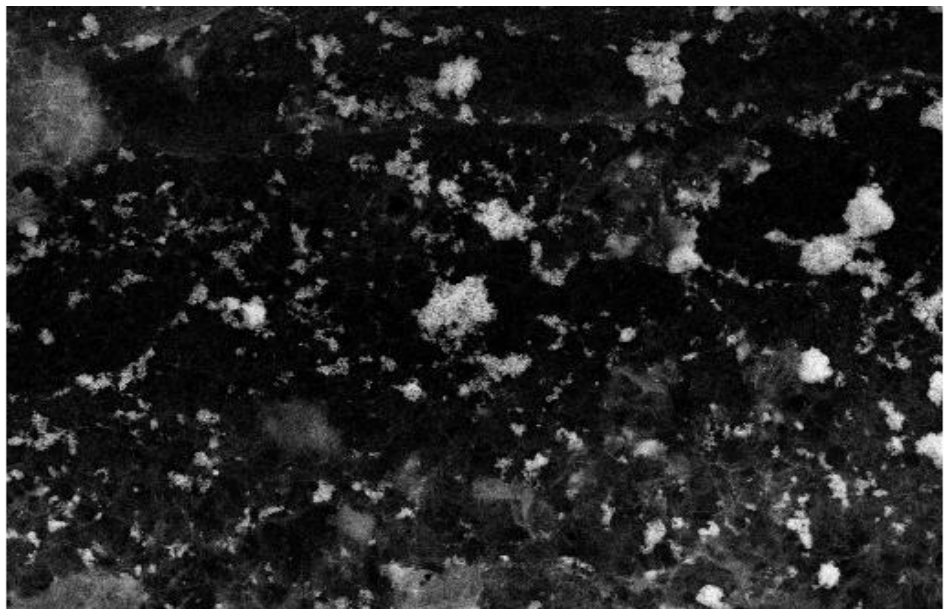
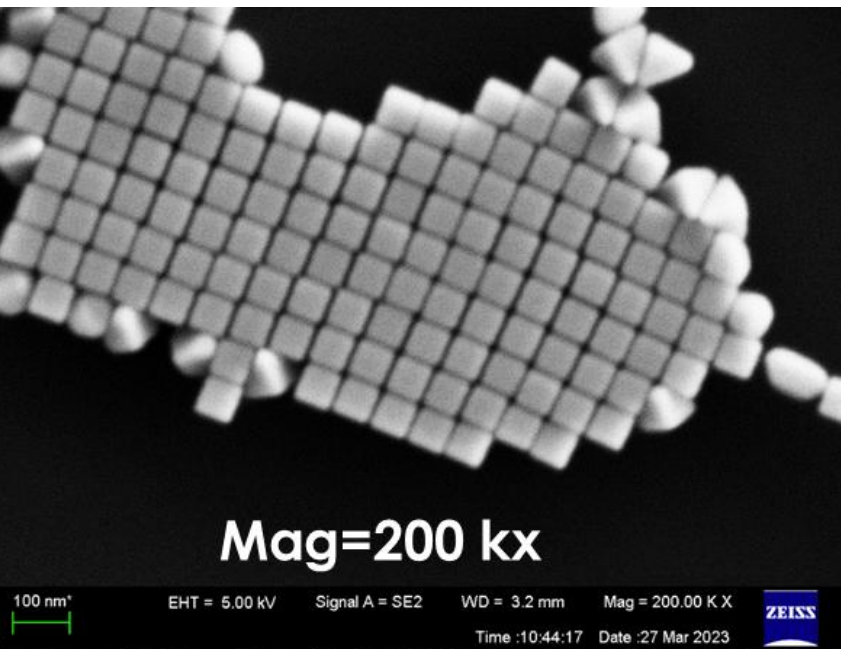
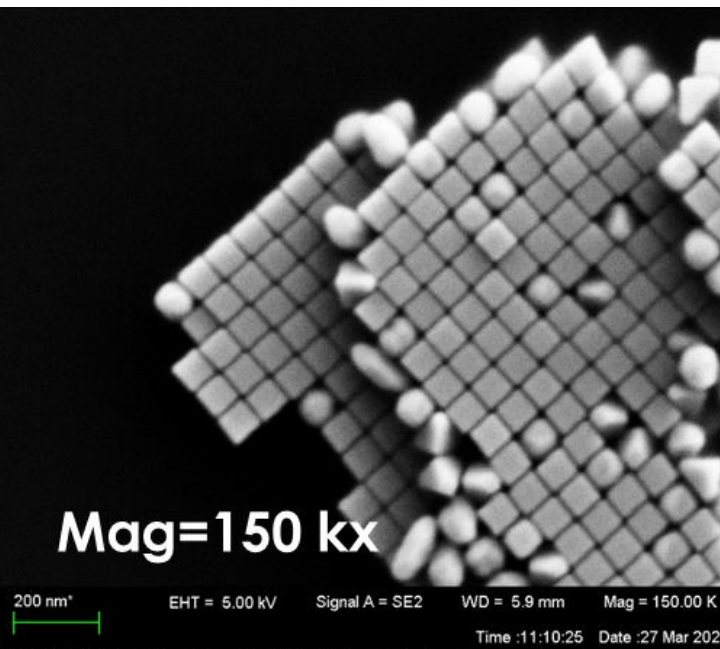
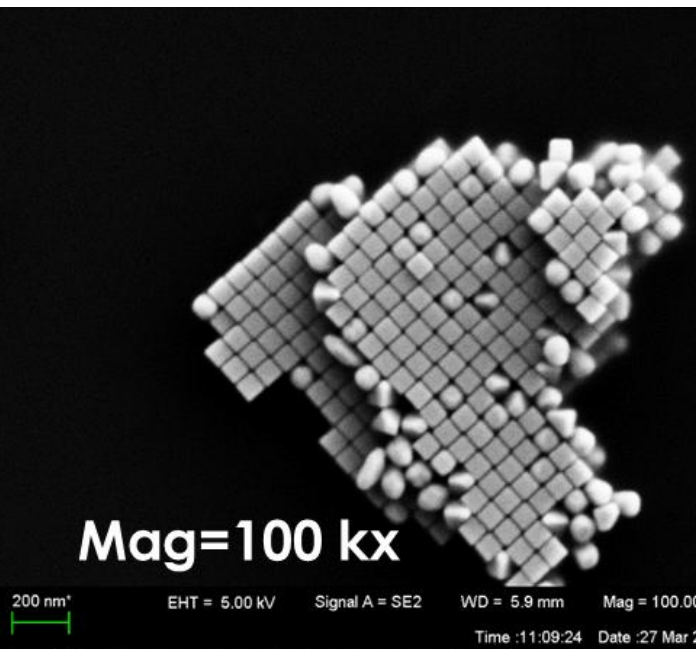
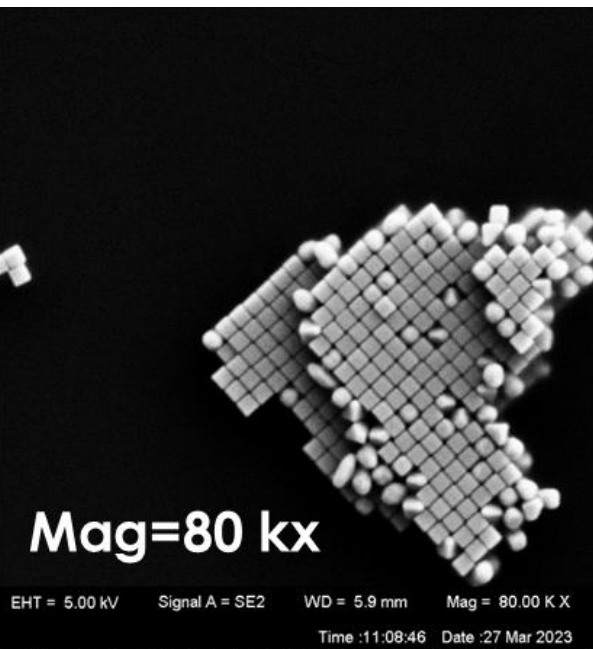
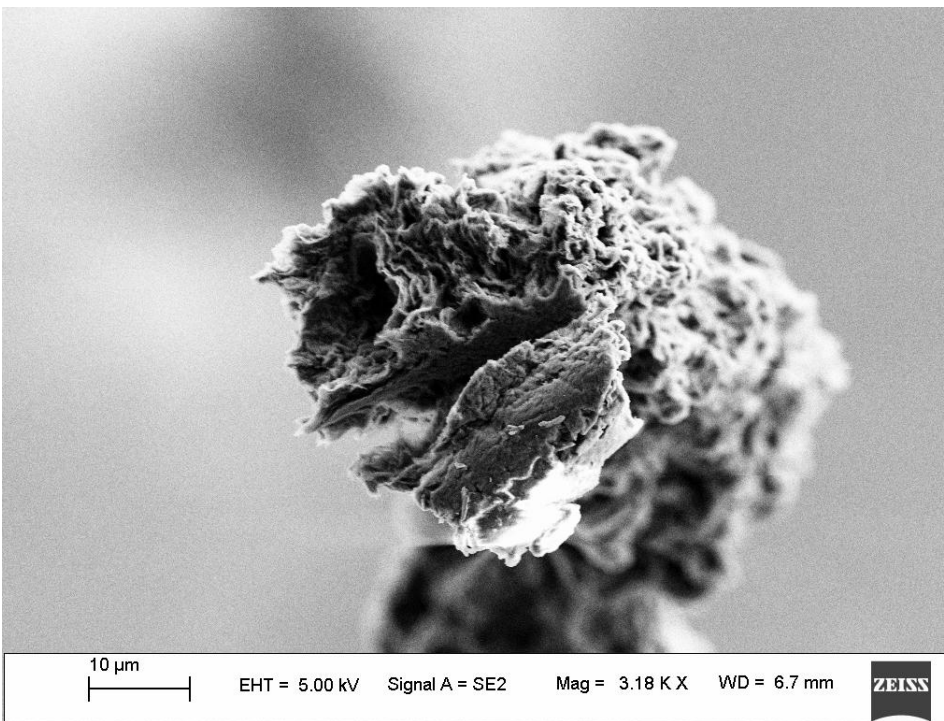
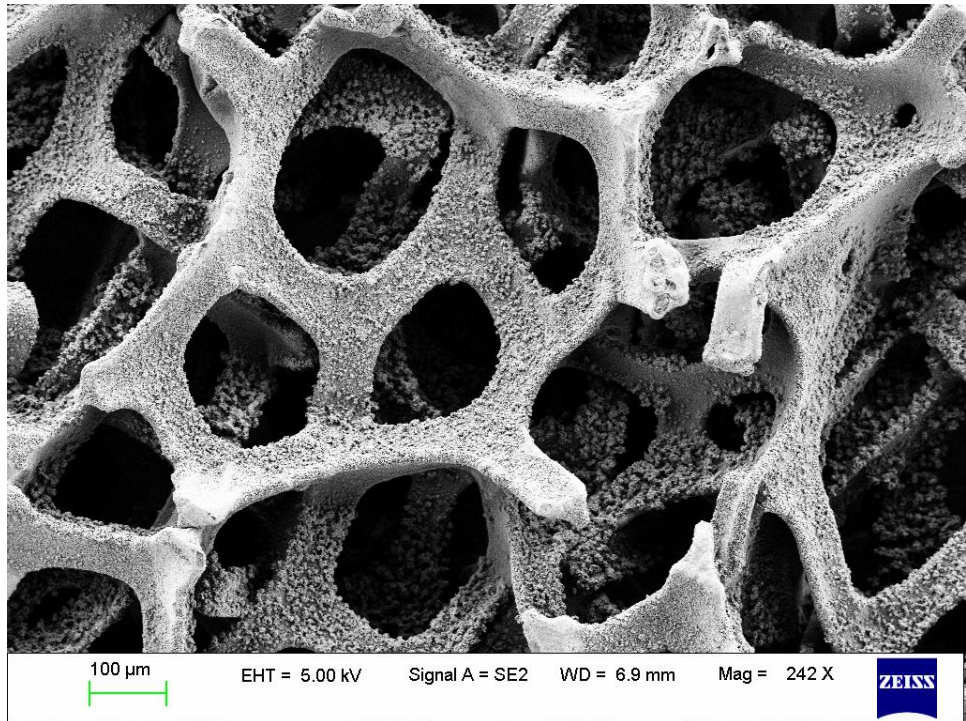
扫描电子显微镜（SEM）平台

欢迎预约使用

依托单位：
极端光学技术与仪器全国重点实验室
浙江大学光电科学与工程学院



扫描电子显微镜（Scanning Electron Microscope, SEM）是一种用于高分辨率微区形貌分析的大型精密仪器。具有景深大、分辨率高，成像直观、立体感强、放大倍数范围宽以及待测样品可在三维空间内进行旋转和倾斜等特点。另外具有可测样品种类丰富，几乎不损伤和污染原始样品以及可同时获得形貌、结构、成分和结晶学信息等优点。广泛应用于生命科学、物理学、化学、司法、地球科学、材料科学以及工业生产等领域的微观研究。



电子图像 1

Pd La1

成分的定性与半定量分析

元素面分布检测

元素能谱检测

负责人：王伟 0571-87953307
Email: wangwei77@zju.edu.cn
地址：杭州市浙江大学浙大路玉泉校区教三128室



极端光学技术与仪器
全国重点实验室



浙大光电

浙江大学大型仪器共享服务平台
搜索“场发射扫描电子显微镜”
仪器编号0906405Q
<https://zjuequip.zju.edu.cn/>

